



# 检验检测报告

## Testing Report

报告编号：SZ20240009936A

试验名称：人体模型静电放电试验

试验样品：CJC4334

试验部门：失效分析工程部

苏试宜特（深圳）检测技术有限公司  
CHINAiSTI (Shenzhen) Testing Technology Co., Ltd.



地址：深圳市宝安区隆昌路 10 号美生创谷工业园春谷 1 楼

# 人体模型静电放电试验报告

## HBM TEST REPORT

委托公司 : 深圳市蒙华科技有限责任公司  
Company  
公司地址 : 深圳市福田区上梅林广夏路蒙华科技大楼 706  
Address  
产品名称 : CJC4334  
Sample name CJC4334  
委托日期 : 2024 年 06 月 06 日  
Date Received Jun 06,2024  
完成日期 : 2024 年 06 月 12 日  
Date Tested Jun 12,2024

### 实验室证明事项 (We Hereby Certify That) :

对于本报告所载之测试项目及结果, 实验室保证由训练合格之专业技术人员负责执行, 并忠实及完整将各项试验结果记录于报告内。

The test(s) shown in the attachment were conducted according to the indicating procedures. We assume full responsibility for the accuracy and completeness of these tests and vouch for the qualifications of all personnel performing them.

	名称 (Name)	签名 (Signature)	日期 (Date)
检测员 Inspector	张恒 Heng Zhang	张恒	2024 年 06 月 12 日
报告审核人 Report reviewer	邢昌万 Changwan Xing	邢昌万	2024 年 06 月 12 日
报告批准人 Approver	蔡甦谷 Suku Tsai	Suku Tsai	2024 年 06 月 12 日

### 备注 (NOTE):

- 本报告内容以任何方式翻印或复印部份者无效。  
This report will be invalid if reproduced in part or altered in any way.
- 本报告仅对检送样品负责, 且分离使用无效。  
This report refers only to the specimen(s) submitted to test, and is invalid if used otherwise.
- 本报告需加盖本公司印鉴及签名始生效。  
This report is ONLY valid with the examination seal and signature of this institute.
- 样品保存自报告签发日起 30 天。  
The tested specimen(s) will only be preserved for thirty days from the date issued, if not collected by the applicant
- 本报告密级为 C3。  
The confidentiality level of this report is C3

# 报 告 内 容

## TABLE OF CONTENTS

<b>1 讯息 (INFORMATION)</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1 案件讯息 (CASE INFORMATION)</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2 试验设备说明 (DESCRIPTION OF TEST EQUIPMENT)</b> .....	<b>2</b>
<b>1.3 环境条件 (AMBIENCE CONDITION)</b> .....	<b>2</b>
<b>1.4 参考文件 (REFERENCE DOCUMENT)</b> .....	<b>2</b>
<b>1.5 测试要求 (TEST REQUIREMENT)</b> .....	<b>2</b>
<b>2 试验结果 (TEST RESULTS)</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1 结果汇整 (SUMMARY)</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2 测试数据 (TEST DATA)</b> .....	<b>5</b>

## 1 讯息 (INFORMATION)

### 1.1 案件讯息 (CASE INFORMATION)

试验样品 Test Sample	批次号 LOT NO.	封装 Package	数量 Quantity
CJC4334	NA	SOP-8	18 pcs

### 1.2 试验设备说明 (DESCRIPTION OF TEST EQUIPMENT)

项目 Items	设备/编号 Equipment/No.	型号 Model	校准截止日期 Calibration Validity
1	9305377	KEYTEK ZAPMASTER 7/4	2024年7月10日

### 1.3 环境条件 (AMBIENCE CONDITION)

标准要求温度 Required temperature	25 <sup>+3</sup> °C	实际温度 Actual temperature	21.3~22.4°C
标准要求相对湿度 Required relative humidity	55± 10 %RH	实际湿度 Actual humidity	59.5~56.0% RH

### 1.4 参考文件 (REFERENCE DOCUMENT)

项目 Items	依据标准 Standards
1	Mil-Std-883L Method 3015.9

### 1.5 测试要求 (TEST REQUIREMENT)

All other pins to VSS(+)  
All other pins to VSS(-)  
All other pins to VCC(+)  
All other pins to VCC(-)  
I/O to I/O(+)  
I/O to I/O(-)

REFERENCE DOCUMENT : MIL-STD-883L Method 3015.9

Zap 3 pulse(s), Interval: 1.0 Sec.

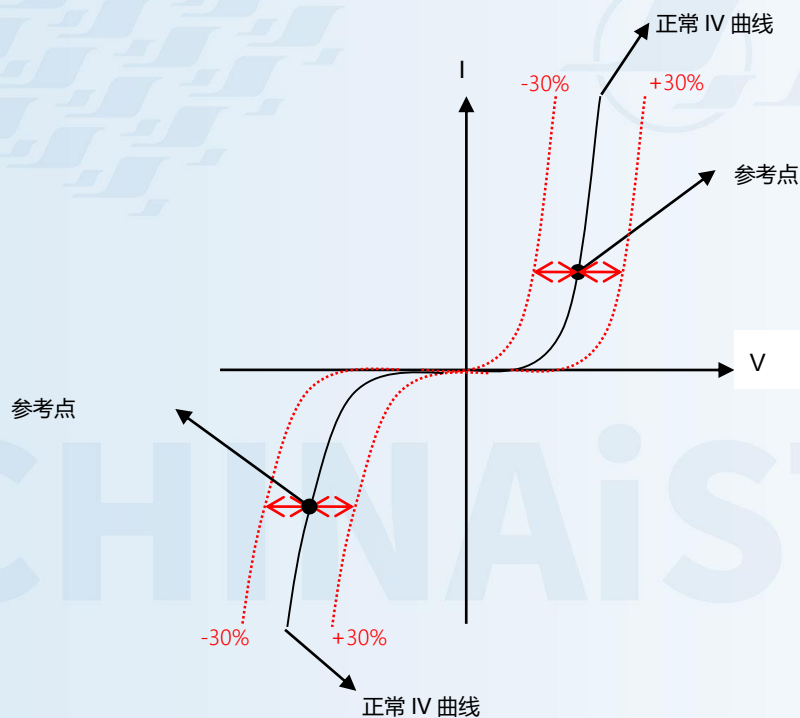
10K ohm shunt : NA

TEST VOLTAGE : 1000V~8000V(±), Step:500V

SAMPLE QUANTITY : 18 pcs

FAILURE CRITERIA : ±30% voltage shift at reference point before/after zapping  
( Reference Only )

※Failure Judgment: Voltage shift over ±30% at reference point.



地址 (Address) : 深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区隆昌路 10 号美生创谷春谷 102

102 Chungu Meishengchuanggu Area 68 Xingdong Community Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province CN

电话 Tel: 86-755-32998696, 传真 (Fax) : 800-988-0501

网址 (web): <http://www.chinaisti.com>



## 2 试验结果 (TEST RESULTS)

### 2.1 结果汇总 (SUMMARY)

Test Model : HBM	ESD Sensitivity Passed : $\pm 6500V$		MIL-STD Class : <u>3A</u>
Test condition	Sample Quantity	Passed Volts	<b>Class 0</b> : < 250V <b>Class 1A</b> : $\geq 250V$ , < 500V <b>Class 1B</b> : $\geq 500V$ , < 1000V <b>Class 1C</b> : $\geq 1000V$ , < 2000V <b>Class 2</b> : $\geq 2000V$ , < 4000V <b>Class 3A</b> : $\geq 4000V$ , < 8000V <b>Class 3B</b> : $\geq 8000V$
All other pins to VSS(+)	3	+8000V	
All other pins to VSS(-)	3	-8000V	
All other pins to VCC(+)	3	+8000V	
All other pins to VCC(-)	3	-6500V	
I/O to I/O(+)	3	+8000V	
I/O to I/O(-)	3	-8000V	

#### Group Set

VSS  
VCC  
I/O

#### Pin List

6  
7  
1-5,8

## 2.2 测试数据 (TEST DATA)

No.	1		
All other pins to VSS(+)			
Tested Pins	Sample No.&Failed Volt		
	#1	#2	#3
1	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
2	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
3	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
4	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
5	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
7	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
8	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)

No.	2		
All other pins to VSS(-)			
Tested Pins	Sample No.&Failed Volt		
	#4	#5	#6
1	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
2	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
3	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
4	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
5	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
7	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
8	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)

No.	3		
All other pins to VCC(+)			
Tested Pins	Sample No.&Failed Volt		
	#7	#8	#9
1	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
2	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
3	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
4	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
5	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
6	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
8	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)

No.	4		
All other pins to VCC(-)			
Tested Pins	Sample No.&Failed Volt		
	#10	#11	#12
1	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
2	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
3	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
4	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
5	FAIL(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
6	FAIL(-7500V)	FAIL(-7500V)	FAIL(-7500V)
8	FAIL(-7000V)	FAIL(-7000V)	FAIL(-7000V)

No.	5		
I/O to I/O(+)			
Tested Pins	Sample No.&Failed Volt		
	#13	#14	#15
1	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
2	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
3	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
4	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
5	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)
8	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)	PASS(+8000V)

地址 (Address): 深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区隆昌路 10 号美生创谷春谷 102

102 Chungu Meishengchuanggu Area 68 Xingdong Community Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province CN

电话 Tel: 86-755-32998696, 传真 (Fax): 800-988-0501

 网址 (web): <http://www.chinaisti.com>

No.	6		
I/O to I/O(-)			
Tested Pins	Sample No.&Failed Volt		
	#16	#17	#18
1	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
2	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
3	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
4	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
5	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)
8	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)	PASS(-8000V)

《以下空白》  
<< The Following Blank >>

CHINAISTI